

**Prüfdokumentation für MICROS Optics Prüftafel
nach amerikanischen Standards**

micros
optics
www.micros-optics.com



RSF Elektronik

Ges.m.b.H.

Elektronische Längen- und
Winkelmessgeräte,
Kabelsysteme, Präzisionsteilungen

MICROS Optics Prüftafel für Oberflächenfehler nach amerikanischen Standards; Artikel 10207

Prüfung der aufgebrachten photolithographischen Struktur

Prüfmerkmal: Länge und Breite der Struktur bei Kratzern. Durchmesser bei kreisförmigen Defekten.

1. Kratzer (Einheiten in mm)

Feld											
5				10				20			
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,005	16	0,0050	16,0013	0,01	16	0,0099	16,0009	0,02	16	0,0200	16,0004

Feld											
40				60				80			
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,04	16	0,0403	16,0004	0,06	16	0,0602	16,0001	0,08	16	0,0799	15,9996

Feld											
120											
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge
0,12	16	0,1198	15,9993								

2. Kreisförmige Defekte (Einheiten in mm)

Feld											
5		10		20		30		40		50	
Soll	Ist										
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
0,05	0,0499	0,10	0,1002	0,20	0,1998	0,30	0,3000	0,40	0,3999	0,50	0,4999

Feld											
70		100									
Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Ø	Ø	Ø	Ø								
0,70	0,7002	1,00	1,0000								

Tarsdorf, 11.01.2022

SIGN 